

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和2年8月27日(2020.8.27)

【公開番号】特開2018-25774(P2018-25774A)

【公開日】平成30年2月15日(2018.2.15)

【年通号数】公開・登録公報2018-006

【出願番号】特願2017-140431(P2017-140431)

【国際特許分類】

G 0 9 G	3/20	(2006.01)
G 0 9 G	3/36	(2006.01)
G 0 9 G	3/3225	(2016.01)
G 0 9 G	3/3275	(2016.01)
G 0 2 F	1/133	(2006.01)
G 0 2 F	1/1368	(2006.01)
G 0 2 F	1/1333	(2006.01)
H 0 1 L	51/50	(2006.01)
H 0 5 B	33/14	(2006.01)

【F I】

G 0 9 G	3/20	6 4 1 P
G 0 9 G	3/36	
G 0 9 G	3/3225	
G 0 9 G	3/3275	
G 0 9 G	3/20	6 4 1 Q
G 0 9 G	3/20	6 3 1 V
G 0 9 G	3/20	6 4 2 J
G 0 9 G	3/20	6 5 0 M
G 0 9 G	3/20	6 2 1 M
G 0 9 G	3/20	6 2 4 B
G 0 9 G	3/20	6 8 0 F
G 0 2 F	1/133	5 5 0
G 0 2 F	1/1368	
G 0 2 F	1/133	5 8 0
G 0 2 F	1/1333	
H 0 5 B	33/14	A
H 0 5 B	33/14	Z

【手続補正書】

【提出日】令和2年7月17日(2020.7.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

画像データを補正する機能を有する第1の機能回路及び第2の機能回路と、
前記第1の機能回路に電気的に接続された第1のスキャンチェーンと、
前記第2の機能回路に電気的に接続された第2のスキャンチェーンと、
前記第1のスキャンチェーン及び前記第2のスキャンチェーンに電気的に接続されたコ

ントローラと、

入力端子と、を有し、

前記コントローラにより、前記第1のスキャンチェーンが動作し、前記第2のスキャンチェーンが動作しないように制御された状態で、前記入力端子から前記第1の機能回路にパラメータのデータが出力されることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記第1のスキャンチェーンに電気的に接続された第1のセレクタと、

前記第2のスキャンチェーンに電気的に接続された第2のセレクタと、さらに有し、

前記コントローラは、前記第1のセレクタと前記第2のセレクタに制御データを供給することを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項1において、

前記第1のスキャンチェーンとクロック線に電気的に接続された第1の論理回路と、

前記第2のスキャンチェーンにと前記クロック線に電気的に接続された第2の論理回路と、さらに有し、

前記コントローラは、前記第1の論理回路と前記第2の論理回路に制御データを供給することを特徴とする半導体装置。

【請求項4】

請求項1において、

前記第1のスキャンチェーンとクロック線に電気的に接続された第1の論理回路と、

前記第2のスキャンチェーンにと前記クロック線に電気的に接続された第2の論理回路と、さらに有し、

前記第1の論理回路と前記第2の論理回路により、前記クロック線から前記第1のスキャンチェーンにクロック信号が出力され、前記第2のスキャンチェーンに前記クロック信号が出力されないことを特徴とする半導体装置。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、

前記第1の機能回路及び前記第2の機能回路に電気的に接続されたモジュールコネクタをさらに有することを特徴とする半導体装置。

【請求項6】

画像データを補正する機能を有する第1の機能回路及び第2の機能回路と、

前記第1の機能回路に電気的に接続された第1のスキャンチェーンと、

前記第2の機能回路に電気的に接続された第2のスキャンチェーンと、

前記第1のスキャンチェーン及び前記第2のスキャンチェーンに電気的に接続されたコントローラと、

入力端子と、

前記第1のスキャンチェーンと前記コントローラの間に設けられた第1のトランジスタと、

前記第2のスキャンチェーンと前記コントローラの間に設けられた第2のトランジスタと、を有し、

前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタのそれぞれのチャネル形成領域は酸化物半導体を有し、

前記コントローラにより、前記第1のスキャンチェーンが動作し、前記第2のスキャンチェーンが動作しないように制御された状態で、前記入力端子から前記第1の機能回路にパラメータのデータが出力されることを特徴とする半導体装置。

【請求項7】

請求項6において、

前記第1のスキャンチェーンに電気的に接続された第1のセレクタと、

前記第2のスキャンチェーンに電気的に接続された第2のセレクタと、さらに有し、

前記コントローラは、前記第1のセレクタと前記第2のセレクタに制御データを供給することを特徴とする半導体装置。

【請求項8】

請求項6において、

前記第1のスキャンチェーンとクロック線に電気的に接続された第1の論理回路と、

前記第2のスキャンチェーンにと前記クロック線に電気的に接続された第2の論理回路と、さらに有し、

前記コントローラは、前記第1の論理回路と前記第2の論理回路に制御データを供給することを特徴とする半導体装置。

【請求項9】

請求項6において、

前記第1のスキャンチェーンとクロック線に電気的に接続された第1の論理回路と、

前記第2のスキャンチェーンにと前記クロック線に電気的に接続された第2の論理回路と、さらに有し、

前記第1の論理回路と前記第2の論理回路により、前記クロック線から前記第1のスキャンチェーンにクロック信号が出力され、前記第2のスキャンチェーンに前記クロック信号が出力されないことを特徴とする半導体装置。

【請求項10】

請求項6乃至請求項9のいずれか一において、

前記第1の機能回路及び前記第2の機能回路に電気的に接続されたモジュールコネクタをさらに有することを特徴とする半導体装置。

【請求項11】

請求項6乃至請求項10のいずれか一において、

反射素子と発光素子を含む画素をさらに有し、

前記第1の機能回路及び前記第2の機能回路の少なくとも一方は、前記反射素子と前記発光素子の少なくとも一方の色調を調整するパラメータを保持し、保持している前記パラメータを用いて前記画像データを補正する調色回路であることを特徴とする半導体装置。

【請求項12】

請求項6乃至請求項10のいずれか一において、

反射素子と発光素子を含む画素をさらに有し、

前記第1の機能回路及び前記第2の機能回路の少なくとも一方は、前記反射素子の反射強度と前記発光素子の発光強度を調整するパラメータを保持し、保持している前記パラメータを用いて前記画像データを補正する調光回路であることを特徴とする半導体装置。

【請求項13】

請求項6乃至請求項10のいずれか一において、

反射素子と発光素子を含む画素をさらに有し、

前記第1の機能回路及び前記第2の機能回路の少なくとも一方は、ガンマ値を保持し、前記ガンマ値を用いて前記画像データを補正するガンマ補正回路であることを特徴とする半導体装置。

【請求項14】

請求項1乃至請求項13のいずれか一に記載の前記半導体装置を用いた電子機器。